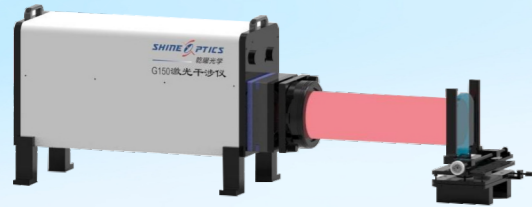


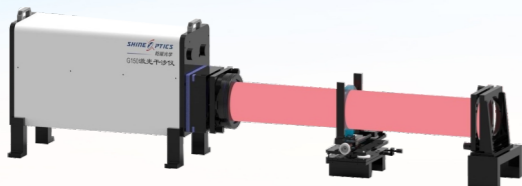
干涉仪测量配置

平面度测量



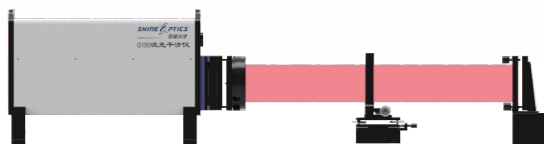
附件：平面透过标准镜 (TF)，平面样品调整架

平面透过波前测量



附件：平面透过标准镜 (TF)，平面样品调整架，平面反射标准镜 (RF)，RF二维卡口调整架

平板平行度测量



附件：平面透过标准镜 (TF)，平面样品调整架，平面反射标准镜 (RF)，RF二维卡口调整架

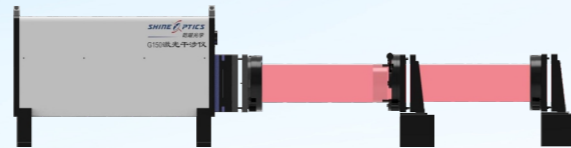
凹面球面镜面形测量：发散镜头可用于测量大曲率凹面



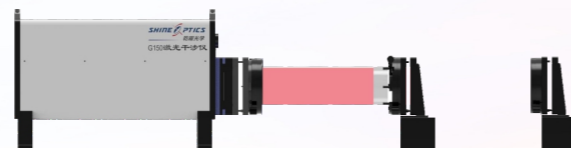
附件：球面标准镜 (TS)，五维调整架，球面测量系统 (导轨和光栅尺)

四步法光学材料均匀性测量

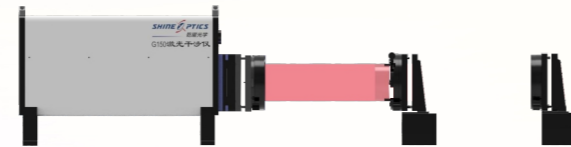
第一步：测量透过波前



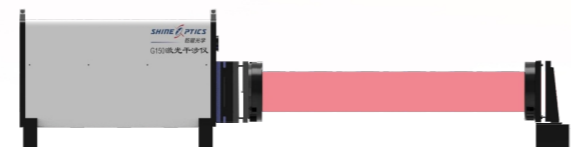
第二步：测量样品前表面面形



第三步：测量样品后表面面形

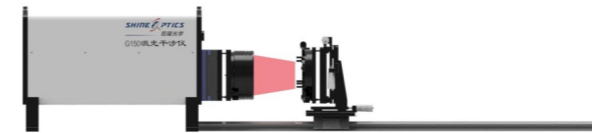


第四步：测量干涉仪空腔



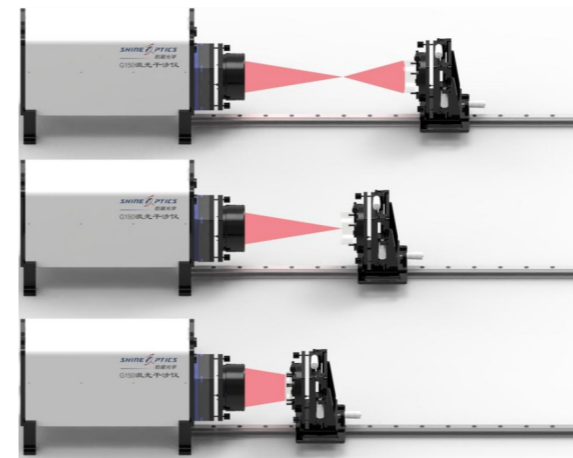
附件：平面透过标准镜 (TF)，平面样品调整架，平面反射标准镜 (RF)，RF二维卡口调整架

凸面球面镜面形测量：长焦汇聚镜头可用于测量大曲率凸面



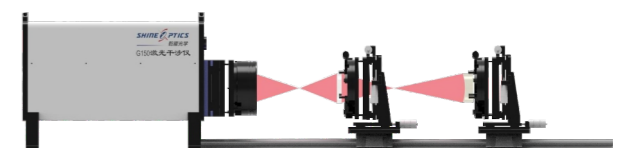
附件：球面标准镜 (TS)，五维调整架，球面测量系统 (导轨和光栅尺)

球面镜曲率半径非接触式测量可选择光栅尺和激光测距仪测曲率

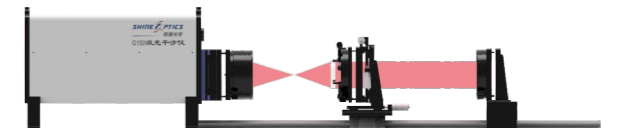


附件：球面标准镜 (TS)，五维调整架，球面测量系统 (导轨、光栅尺或激光测距仪)

光学系统的透过波前测量。不同的光路可测量有限远和无限远光学系统



附件：球面标准镜 (TS)，五维调整架 (2组)，球面测量系统，球面反射标准具 (RS)



附件：球面标准镜 (TS)，五维调整架，球面测量系统，平面反射标准镜 (RF)，RF二维卡口调整架



附件：平面透过标准镜 (TF)，五维调整架 (2组)，球面测量系统，球面反射标准具 (RS)

型号	名称	照片
G150-4TZJ	平面样品调整架	
G100-2TZJ	100mm二维卡口调整架, RF	
G150-2TZJ	150mm二维卡口调整架, RF	
G100-5TZJ	五维调整架, 最大加持110mm	
G150-5TZJ	五维调整架, 最大加持160mm	
G150-QCL	球面测量系统 (导轨和光栅尺)	